

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19052-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 21.10.2022

Ausstellungsdatum: 21.10.2022

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Instrument Systems GmbH

Mit seinem Prüflaboratorium

Instrument Systems GmbH
Kastenbauerstraße 2, 81677 München
Kaiserin-Augusta-Allee 16-24, 10533 Berlin

Das Prüflaboratorium erfüllt die Mindestanforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 und gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, um die nachfolgend aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

Lichttechnik

Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.
Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

**Vor Ort *) nur Prüfungen an Display-Mess-Systemen (DMS) und Photometern der Firma
Instrument Systems GmbH
Standort München**

| Fachbereich | Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand | Titel der Norm oder des Prüfverfahrens | Prüfbereich / Einschränkungen zum Prüfverfahren |
|--------------|--|--|--|
| Lichttechnik | CIE 63:1984 | Spektroradiometrische Messungen an Lichtquellen The spectroradiometric measurement of light sources | - spektrale Bestrahlungsstärke von 200 nm bis 2500 nm - Lichtstrom, Teillichtstrom und spektrale Strahlungsleistung im Wellenlängenbereich von 360 nm bis 1100 nm Auch Prüfungen vor Ort*) - Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1100 nm |
| Lichttechnik | ISO 23539:2005 | Photometrie - Das CIE-System der physikalischen Photometrie | - Lichtstrom und spektrale Strahlungsleistung im Wellenlängenbereich von 360 nm bis 1100 nm Auch Prüfungen vor Ort*) - Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1100 nm |
| | CIE S 010:2004 | Photometry - The CIE System of Physical Photometry | |
| Lichttechnik | DIN 5032-1:1999 | Lichtmessung - Teil 1: Photometrische Verfahren | Auch Prüfungen vor Ort*) - Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1100 nm |

| Fachbereich | Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand | Titel der Norm oder des Prüfverfahrens | Prüfbereich / Einschränkungen zum Prüfverfahren |
|--------------|--|---|--|
| Lichttechnik | DIN EN 13032-1:2012 | Licht und Beleuchtung - Messung und Darstellung photometrischer Daten von Lampen und Leuchten | - spektrale Bestrahlungsstärke von 200 nm bis 2500 nm - Lichtstrom und spektrale Strahlungsleistung im Wellenlängenbereich von 360 nm bis 1100 nm Auch Prüfungen vor Ort*) - Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1100 nm |
| Lichttechnik | CIE 202:2011 | Bestimmung der spektralen Empfindlichkeitsverteilung von Detektoren, Radiometern und Photoempfängern Spectral responsivity measurement of detectors, radiometers and photometers | Prüfung der spektralen Empfindlichkeit von Photodetektoren. |
| Lichttechnik | CIE 84:1989 | Lichtstrommessung The measurement of luminous flux | Lichtstrom |
| Lichttechnik | CIE 239:2020 | Goniospektrometrie von optischen Strahlungsquellen Goniospectroradiometry of Optical Radiation Sources | Strahlungsleistung und Lichtstrom |
| Lichttechnik | CIE:127:2007 | LED Messungen Measurement of LEDs | - mittlere Lichtstärke für LEDs (ILED A und ILED B) |
| | CIE S025:2015 | Testmethode für LED-Lampen, LED-Leuchten und LED-Module Test method for LED lamps, LED luminaires and LED modules | - Lichtstrom und Strahlungsleistung für LEDs |

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19052-01-00

| Fachbereich | Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand | Titel der Norm oder des Prüfverfahrens | Prüfbereich / Einschränkungen zum Prüfverfahren |
|--------------|---|--|--|
| Lichttechnik | ISO/CIE 11664-1:2019 DIN EN ISO 11664-1:2020 | Farbmetrik - Teil 1: CIE farbmétrische Normalbeobachter | Auch Prüfungen vor Ort*) Tristimuluswerte X,Y,Z und die von diesen durch Berechnung ableitbaren Farbmessgrößen |
| | CIE S 014-1:2006 | Colorimetry — Part 1: CIE Standard Colorimetric Observers | |
| Lichttechnik | ISO 11664-2:2007 DIN EN ISO 11664-2:2011 | Farbmetrik - Teil 2: CIE Normlichtarten | Tristimuluswerte X,Y,Z und die von diesen durch Berechnung ableitbaren Farbmessgrößen |
| | CIE S 014-2:2006 | CIE Standard Illuminants for Colorimetry | |
| Lichttechnik | ISO/CIE 11664-3:2019 DIN EN ISO 11664-3:2020 | Farbmetrik - Teil 3: CIE-Farbwerte | Auch Prüfungen vor Ort*) Tristimuluswerte X,Y,Z und die von diesen durch Berechnung ableitbaren Farbmessgrößen |
| | CIE S 014-3:2011 | Colorimetry - Part 3: CIE tristimulus values | |
| Lichttechnik | ISO/CIE 11664-5:2016 | Farbmetrik - Teil 5: CIE 1976 L*u*v*-Farbenraum und gleichabständige u', v'-Farbtafel | Auch Prüfungen vor Ort*) Tristimuluswerte X,Y,Z und die von diesen durch Berechnung ableitbaren Farbmessgrößen |
| | DIN EN ISO 11664-5:2017 | Colorimetry — Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour Space and u', v' Uniform Chromaticity Scale Diagram | |

Standort Berlin

| Fachbereich | Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand | Titel der Norm oder des Prüfverfahrens | Prüfbereich / Einschränkungen zum Prüfverfahren |
|--------------|--|--|--|
| Lichttechnik | CIE 63:1984 | Spektroradiometrische Messungen an Lichtquellen The spectroradiometric measurement of light sources | Auch Prüfungen vor Ort*) - Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1100 nm |
| Lichttechnik | DIN 5032-1:1999 | Photometrische Verfahren | - Lichtstärke Auch Prüfungen vor Ort*) - Beleuchtungsstärke Auch Prüfungen vor Ort*) - Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1100 nm |
| Lichttechnik | DIN EN 13032-1:2012 | Licht und Beleuchtung - Messung und Darstellung photometrischer Daten von Lampen und Leuchten | Auch Prüfungen vor Ort*) - Beleuchtungsstärke |
| Lichttechnik | DIN 5032-2:1992 | Lichtmessung, Betrieb elektrischer Lampen und Messungen der zugehörigen Größe | - Lichtstärke Auch Prüfungen vor Ort*) - Beleuchtungsstärke |
| Lichttechnik | ISO 23539:2005 | Photometry - The CIE System of Physical Photometry | - Lichtstärke Auch Prüfungen vor Ort*) - Beleuchtungsstärke |
| | CIE S 010:2004 | | Auch Prüfungen vor Ort*) - Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1100 nm |

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19052-01-00

| Fachbereich | Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand | Titel der Norm oder des Prüfverfahrens | Prüfbereich / Einschränkungen zum Prüfverfahren |
|--------------|---|---|--|
| Lichttechnik | ISO 11664-1:2019 DIN EN ISO 11664-1:2011 | Farbmetrik - Teil 1: CIE farbmetrische Normalbeobachter | Auch Prüfungen vor Ort*) Tristimuluswerte X,Y,Z und die von diesen durch Berechnung ableitbaren Farbmessgrößen |
| | CIE S 014-1:2006 | Colorimetry — Part 1: CIE Standard Colorimetric Observers | |
| Lichttechnik | ISO 11664-2:2007 DIN EN ISO 11664-2:2011 | Farbmetrik - Teil 2: CIE Normlichtarten | - Lichtstärke - Beleuchtungsstärke |
| | CIE S 014-2:2006 | CIE Standard Illuminants for Colorimetry | |
| Lichttechnik | ISO 11664-3:2012 DIN EN ISO 11664-3:2013 | Farbmetrik - Teil 3: CIE-Farbwerte Colorimetry - Part 3: CIE tristimulus values | Auch Prüfungen vor Ort*) Tristimuluswerte X,Y,Z und die von diesen durch Berechnung ableitbaren Farbmessgrößen |
| | CIE S 014-3:2011 | | |
| Lichttechnik | ISO/CIE 11664-5:2016 DIN EN ISO 11664-5:2017 | Farbmetrik - Teil 5: CIE 1976 L*u*v*-Farbenraum und gleichabständige u', v'-Farbtafel Colorimetry — Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour Space and u', v' Uniform Chromaticity Scale Diagram | Auch Prüfungen vor Ort*) Tristimuluswerte X,Y,Z und die von diesen durch Berechnung ableitbaren Farbmessgrößen |

Vor Ort *) nur Prüfungen an Display-Mess-Systemen (DMS) und Photometern der Firma Instrument Systems GmbH